

(363)

平行導体と導磁枠による薄鋼板の磁粉探傷法

川崎製鉄㈱ 水島製鉄所 小石想一 ○永倉義之 松本延雄

1. 緒言 深絞りを受ける薄鋼板の微細介在物検出の手段として、一般に磁粉探傷試験(MT)が実施されている。かかるMTでは、欠陥評価精度維持と試験能率向上のため、広い試験面内に均一で高い磁場を作ることが重要な課題である。この問題を解決するために平行導体と導磁枠を組合せた磁化方法(P.F.MT)を考案し、薄鋼板の介在物検査への適用を検討した。

2. 磁化の概念と装置の構成

電磁石(極間法等)によ
る試験面磁場は、図3に示
すよう不均一である。

当P.F.MT法は図1に示
すように、強磁性材製の導
磁枠の中に通電体を通し、図1 P.F.MT法の模式図
通電中に発生する磁場によ

って被検物を磁化する。生成された磁束は被検物によ
って閉磁路をつくり、薄い被検物に強い磁場を形成する。被検
物内の欠陥を検出するに必要な均一な磁場を得るには、予め磁
化電流と通電体位置を決めておけばよい。

今、薄鋼板を長さ方向 500mmにわたり均一に磁化するための
適正条件を直交配列実験によって求めると表1のようになる。
その時の磁束密度の分布を図2に示す。

表1 実験装置の構成寸法

導磁枠寸法 (mm)	3.2t×500W×250H
通電体数 (本)	3 (40φ Al-Bar)
通電体位置 (mm)	(1/2H-20), 1/3W
磁化電流 (Amp)	DC-800

3. 測定結果

0.3~0.8mmの薄鋼板を表1に示す条件で探傷した。同一サンプルの探傷結果を極間法と比較すると、P.F.MT法は約1.5倍の欠陥検出個数が得られた。また、P.F.MT法で検出した欠陥指示部の断面顕微鏡観察を行ない、介在物の寸法と探傷面から
の深さを求めた。結果の一例を図4に示す。

4. 結論

薄鋼板の微細介在物を検出するMT法で、新しい磁化方法を考
案し、適用した。その結果、広い試験面に均一な磁場が容易に
得られ能率的で精度の良い介在物検出が可能になった。

5. 参考文献

① R. F. Lumb et al.: METAL CONST. 9 (1977), 8

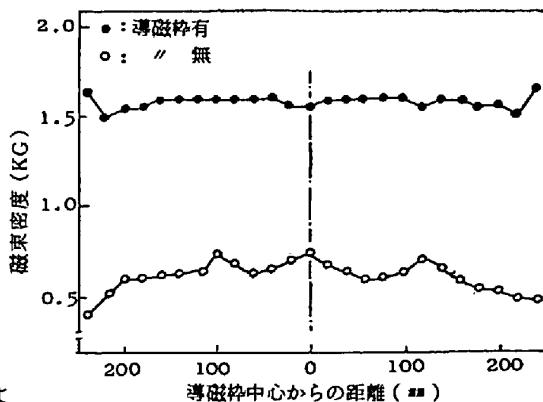
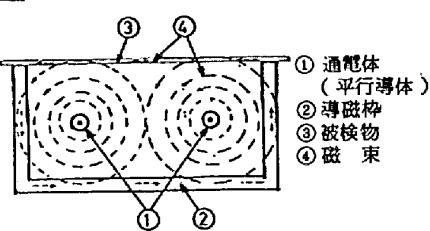


図2 試験面内の磁束密度

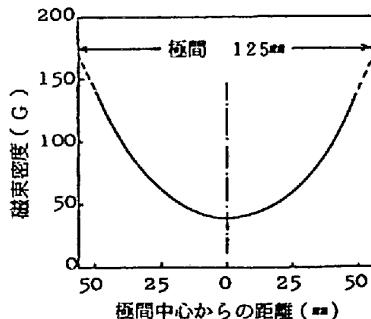


図3 極間法の極間磁束密度(例)

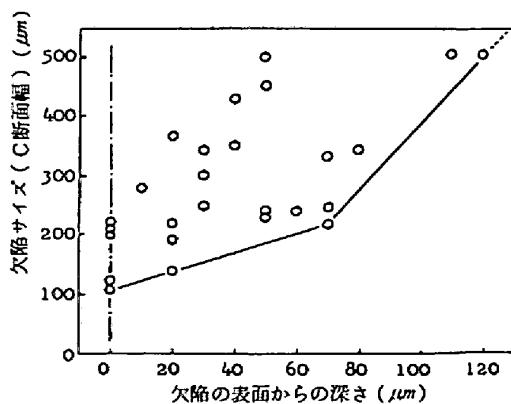


図4 検出介在物の深さとサイズ